Электрические параметры поликристаллов редкоземельных полупроводников с составами Sm_{1-r}Eu_rS

© В.В. Каминский, М.М. Казанин, М.В. Романова, Г.А. Каменская, Н.В. Шаренкова

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия E-mail: vladimir.kaminski@mail.ioffe.ru

(Получена 19 февраля 2016 г. Принята к печати 26 февраля 2016 г.)

Исследованы электрические параметры поликристаллов с составами Sm_{1-x}Eu_xS. Измерены удельная электропроводность, концентрация свободных электронов, их подвижность и энергия активации проводимости в зависимости от величины х. Определены структурные параметры исследованных составов. Изготовлена гетероструктура со значениями x от 0 до 0.3, измерена величина электрического напряжения, генерируемая структурой при ее нагреве до $T = 450 \,\mathrm{K}$ за счет термовольтаического эффекта. Она составила 55 мВ. Описан способ измерения термовольтаического эффекта, позволяющий отделить его от эффекта Зеебека.

Моносульфиды самария и европия относятся к редкоземельным полупроводникам. Они имеют одинаковую кристаллическую структуру (тип NaCl) и одинаковый параметр кристаллической решетки a = 5.97 Å. Однако электрические свойства их различны. Это объясняется тем, что локализованные 4f-уровни ионов редкоземельного элемента находятся на различной глубине относительно дна зоны проводимости, 0.23 и 1.7 эВ для SmS и EuS соответственно. Сочетание сходства структуры с различием электрических свойств является хорошей предпосылкой для создания гетероструктур с электрическими параметрами, варьируемыми в широких пределах. Такие структуры могут быть использованы для генерации электрического напряжения за счет термовольтаического эффекта [1]. Цель работы — исследование электрических параметров поликристаллических образцов $Sm_{1-x}Eu_xS$ в зависимости от x с целью изготовления гетероструктур с заранее заданными параметрами.

В экспериментах использовались поликристаллические образцы составов $Sm_{1-x}Eu_xS$, где x = 0.1, 0.3,0.6, 0.7 и 1. Они были получены из поликристаллов SmS и EuS, которые были синтезированы из простых веществ по методике, описанной в работе [2]. Количества порошков SmS и EuS брались в соответствии с величиной х требуемого состава, перемешивались, брикетировались и отжигались. Был изготовлен также двухслойный образец с составом Sm_{0.7}Eu_{0.3}S/SmS с весовым соотношением слоев 1:2. Образец был получен спеканием предварительно спрессованных слоев Sm_{0.7}Eu_{0.3}S и SmS в вакууме (10^{-5} Topp) в течение t = 30 мин при T = 1770 К. Синтезированные образцы имели вид монолитных параллелепипедов с размерами $\sim 20 \times 6 \times 3$ мм. Двухслойный образец имел четкую границу раздела фаз. Контроль состава проводился с помощью рентгеноспектрального анализа поверхностей, а для двухслойного образца также и визуального осмотра поверхностей после послойного сошлифовывания (поверхности образцов составов, близких к SmS, имеют золотистый цвет). На рис. 1 представлена зависимость постоянной кристаллической решетки исследованных образцов

от состава х. Наблюдается некоторое отклонение от закона Вегарда (прямая на рис. 1) при x = 0.6. Это отклонение, по всей вероятности, связано с переменной валентностью иона самария. Характерные размеры областей когерентного рассеяния рентгеновского излучения исследованных образцов (размеры нанокристаллитов) составляли 600 ± 100 Å.

Измерения электропроводности проводились четырехзондовым методом на постоянном токе в температурном интервале 300-450 К. Концентрация свободных электронов определялась из измерения эффекта Холла на постоянном токе в постоянном магнитном поле. Подвижность носителей заряда определялась из коэффициента Холла и электропроводности при T = 300 К. Энергия активации проводимости определялась из ее температурной зависимости в интервале 300-420 К.

Термовольтаический эффект измерялся аналогично тому, как это было сделано в [1]. При измерении эдс, возникающей при нагреве, фиксация грани SmS-слоя на нижнем контакте из Ni и изолированном корпусе нагревателя осуществлялась верхним прижимным



Рис. 1. Зависимость параметра кристаллической решетки образцов Sm_{1-x}Eu_xS, определенного методом экстраполяции в интервале углов $\theta = 50-75^{\circ}$ С, от состава.



Рис. 2. Зависимость удельного сопротивления (1) и концентрации носителей заряда (2) образцов $Sm_{1-x}Eu_xS$ от состава (T = 300 K).



Рис. 3. Зависимость подвижности носителей заряда в образцах $Sm_{1-x}Eu_xS$ от состава (T = 300 K).

контактом-зондом. В этом случае направление теплового потока было перпендикулярно границе раздела слоев. Контроль температуры осуществлялся термопарой медьконстантан, изолированной от слоя состава Sm_{0.7}Eu_{0.3}S. При нагревании возникающий сигнал эдс синхронно с сигналом температуры регистрировался аналогоцифровым преобразователем персональной ЭВМ.

На рис. 2 (кривая *I*), представлены результаты измерений зависимости удельного электросопротивления поликристаллов твердых растворов замещения с составами $\text{Sm}_{1-x}\text{Eu}_x\text{S}$ от величины *x*, снятые на 10 образцах при T = 300 К. Наблюдается линейная зависимость логарифма электросопротивления от состава. С ростом *x* сопротивление увеличивается более чем на 6 порядков.

На рис. 2 (кривая 2) представлена зависимость логарифма концентрации электронов проводимости от состава, полученная на тех же 10 образцах при T = 300 К. Наблюдается уменьшение концентрации электронов с увеличением x на 5 порядков. Такая разница (6 и 5 порядков у ρ и *n* соответственно) говорит об изменении подвижности носителей при увеличении *x*, что в свою очередь свидетельствует об изменении характера электропереноса (при *x* > 0.6).

На рис. З представлена зависимость подвижности носителей заряда от состава, полученная на той же группе образцов. Наблюдается существенное снижение подвижности у образца с составом EuS. Для проверки наличия такого спада были проведены измерения подвижности носителей заряда еще на четырех образцах EuS. Полученные величины укладываются в представленный на рис. 3 интервал значений, что подтверждает уменьшение подвижности. Уменьшение подвижности может быть связано с возникновением прыжкового механизма электропереноса наряду с зонным, как это имеет место в тонких поликристаллических пленках SmS [3] и поликристаллах Sm₃S₄ [4]. Возникновение дополнительного прыжкового механизма проводимости приводит к повышению концентрации носителей, что мы и наблюдаем на рис. 2 (кривая 2) при x > 0.6. Такое повышение концентрации может быть связано с изменением валентности иона $\text{Sm}^{2+} \rightarrow \text{Sm}^{3+} + e$, которое находит отражение в уменьшении параметра решетки твердого раствора при x = 0.6 (см. рис. 1).

На рис. 4 представлена зависимость энергии активации электропроводности от состава поликристаллов $Sm_{1-x}Eu_xS$. С ростом *x* наблюдается монотонный рост энергии активации примерно на порядок. По аналогии с результатами, полученными для тонких поликристаллических пленок EuS [5], активация электронов проводимости в образце EuS происходит с энергетических уровней, связанных с 4f-уровнями ионов европия, находящихся в вакансиях подрешетки серы. Одинаковы и величины энергии активации в пленке и поликристалле EuS, ~ 0.45 эВ. По всей видимости, энергии активации электронов проводимости во всех промежуточных составах $Sm_{1-x}Eu_xS$ также связаны с редкоземельными ионами, находящимися вне регулярных узлов кристаллической



Рис. 4. Зависимость энергии активации носителей заряда в образцах $Sm_{1-x}Eu_xS$ от состава.

Физика и техника полупроводников, 2016, том 50, вып. 9



Рис. 5. Зависимость выходного сигнала U и температуры T от времени для гетероструктуры Sm_{0.7}Eu_{0.3}S/SmS.



Рис. 6. Температурная зависимость выходного сигнала U гетероструктуры Sm_{0.7}Eu_{0.3}S/SmS: 1 — нагрев, 2 — охлаждение, 3 — термовольтаический эффект.

решетки, поскольку в противном случае энергии были бы значительно выше, до 1.7 эВ. Эти уровни в энергетической схеме рассматриваемых твердых растворов являются донорными и определяют электрические свойства образца при температурах до ~ 500 К.

На рис. 5 представлена экспериментальная зависимость выходного сигнала и температуры от времени для образца $Sm_{0.7}Eu_{0.3}S/SmS$. Следует обратить внимание на то, что при нагреве к сигналу термовольтаического эффекта прибавляется сигнал от эффекта Зеебека. При охлаждении сигнал от эффекта Зеебека вычитается из сигнала термовольтаического эффекта. Это происходит потому, что направление градиента температуры при нагреве и охлаждении меняется, а направление градиента концентрации донорных уровней – нет. На рис. 6 представлена зависимость выходного сигнала от температуры, полученная из данных, представленных на рис. 5. Здесь кривая 1 соответствует выходному сигналу

Физика и техника полупроводников, 2016, том 50, вып. 9

при нагреве образца, а кривая 2 — при охлаждении. Истинный выходной сигнал от термовольтаического эффекта находится между этими кривыми (кривая 3).

Исследованные электрические параметры твердых растворов Sm_{1-x}Eu_xS говорят о возможности использования данных полупроводниковых соединений для получения электрического напряжения за счет термовольтаического эффекта. При этом особенно перспективными выглядят соединения с составом 0 < x < 0.7, поскольку в этом интервале составов сохраняется в основном зонный механизм проводимости. В данном интервале с увеличением х удельное электросопротивление плавно изменяется от 10^{-2} до $10^2 \, \mathrm{Om} \cdot \mathrm{cm}$, концентрация свободных электронов уменьшается от 10^{19} до 10^{16} см⁻³, их подвижность составляет $8-10 \,\mathrm{cm}^2/\mathrm{B}\cdot\mathrm{c}$, а энергия активации носителей заряда увеличивается от характерных для SmS значений до 0.25 эВ (рис. 4). При x > 0.7 характер электропереноса меняется, и наряду с зонным возникает прыжковый механизм проводимости, что приводит к увеличению разброса электрических параметров образцов с одними и теми же составами. Это существенно ухудшает воспроизводимость параметров изготовленных гетероструктур.

Авторы благодарны Ю.В. Марковой за помощь в работе.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 14-08-00591-а. В.В. Каминский и Н.В. Шаренкова благодарят за финансовую поддержку ООО "СмС тензотерм Рус".

Список литературы

- В.В. Каминский, М.М. Казанин, С.М. Соловьев, А.В. Голубков. ЖТФ, 82 (6), 142 (2012).
- [2] А.В. Голубков, Е.В. Гончарова, В.П. Жузе, Г.М. Логинов, В.М. Сергеева, И.А. Смирнов. Физические свойства халькогенидов редкоземельных элементов (Л., Наука, 1973).
- [3] Л.Н. Васильев, В.В. Каминский, Ю.М. Курапов, М.В. Романова, Н.В. Шаренкова. ФТТ, 38 (3), 779 (1996).
- [4] Л.Н. Васильев, В.В. Каминский, М.В. Романова. ФТТ, 38 (7), 2034 (1996).
- [5] В.В. Каминский, Н.Н. Степанов, М.М. Казанин, А.А. Молодых, С.М. Соловьев. ФТТ, 55 (5), 991 (2013).

Редактор А.Н. Смирнов

Electrical parameters of rare earth semiconductor polycrystals with compositions $Sm_{1-x}Eu_xS$

V.V. Kaminskii, M.M. Kazanin, M.V. Romanova, G.A. Kamenskaya, N.V. Sharenkova

loffe Institute, 194021 St. Petersburg, Russia

Abstract The electrical parameters of $\text{Sm}_{1-x}\text{Eu}_x\text{S}$ polycrystals were studied. Conductivity, concentration of conduction electrons, their mobility and conductance activation energy depending on the value of *x* were measured. Structure parameters of studied compositions were determined. Heterostructure with the values of *x* from 0 to 0.3 was made; the value of electrical voltage generating by the structure during its heating up to T = 450 K owing to thermovoltaic effect was measured. It amounted 55 mV. The method of measurement of thermovoltaic effect.